

## **АННОТАЦИЯ**

к рабочей программе дисциплины

«Физические основы измерений в технологии наноструктурных материалов»

**Направление подготовки** 27.04.01 СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ

**Профиль** Метрология наноструктур и нанотехнологий

**Квалификация выпускника** магистр

**Нормативный период обучения** 2 года

**Форма обучения** очная

**Год начала подготовки** 2017

**Цель изучения дисциплины:** получение студентами основных научно-практических знаний о современном мировоззрении на физическую картину мира и получения данных об объектах.

**Задачи изучения дисциплины:** получение знаний о физических явлениях, лежащих в основе измерений и создания эталонов.

### **Перечень формируемых компетенций:**

ПВК-1 - готовностью к сбору, обработке, анализу, систематизации и обобщению научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по направлению исследований, выбору рациональных методов и средств при решении практических задач, разработке рабочих планов и программ проведения научных исследований и перспективных технических разработок, подготовке отдельных заданий для исполнителей, подготовке научно-технических отчетов, обзоров и публикаций по результатам выполненных исследований и разработок

ПВК-4 - способность анализировать и синтезировать, находящуюся в распоряжении исследователя информацию и принимать на этой основе адекватные решения

ПВК-5 - исследовать причины появления некачественной продукции на производстве и разрабатывать предложения по предупреждению и устранению причин низкого качества продукции и управлению несоответствующей продукцией

ПВК-6 - производить оценку качества измерений, контроля и испытаний, обеспечивать эффективность измерений

**Общая трудоемкость дисциплины:** 14 з.е.

**Форма итогового контроля по дисциплине:** Экзамен

